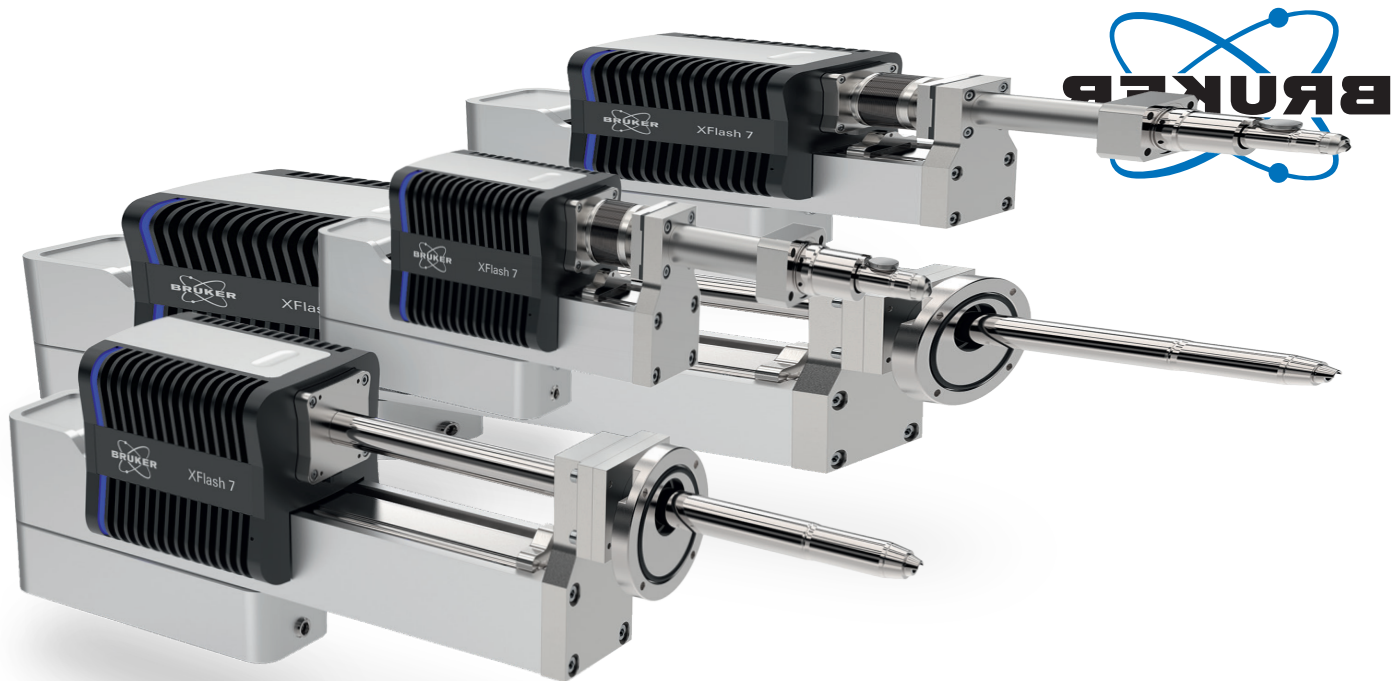




ای دی اس

ایکس فلش® V

جدیدترین نسل آشکارساز برای سیستم QUANTAX EDS

بهترین دید را از نمونه خود دریافت کنید

جدیدترین نسل سیستم های QUANTAX EDS شرکت Bruker مجهز به XFlash هستند. سری 7 آشکارساز، بزرگترین زاویه فضایی، بالاترین توان عملیاتی و بالاترین زاویه برخاست را برای جمع آوری اشعه ایکس در میکروسکوپ های الکترونی فراهم می کند. QUANTAX EDS در ترکیب با نرم افزار مازولار ESPRIT، سریع ترین و قابل اعتمادترین نتایج را ارائه می دهد و بهترین کیفیت داده ها را برای تحقیقات شتابمین می کند.

ایکس فلش® خانواده آشکارسازهای 7 بار دیگر استانداردهایی را در عملکرد و قابلیت طیف سنجی پراکندگی انرژی برای میکروسکوپ های الکترونی (SEM و TEM)، پرتو یونی متمرکز (FIB-SEM) و میکروآنالیزهای پروب الکترونی (EPMA) تعیین می کنند:

f بالاترین راندمان به دلیل فناوری باریک خط، طراحی زاویه جمع آوری بزرگ، جدیدترین نسل پردازش پالس

f بالاترین انعطاف پذیری با طیف گسترده ای از اندازه های آشکارساز و گزینه های پنجره، ارائه راه حل های ایده آل برای میکرو و نانوآنالیز

نوآوری با صداقت

f بالاترین عملکرد طیفی با بهترین وضوح انرژی برای آنالیز عناصر سبک و انرژی کم

f بالاترین دقت نتایج با الگوریتم های پیچیده ی کمی سازی و ترکیبی منحصر به فرد از روش های بدون استاندارد و مبتنی بر استاندارد

تحلیل عناصر خود را کارآمدتر کنید

ایکس فلش® 7 آشکارساز، راهکارهای تحلیلی بهینه شده ای را برای هر نوع میکروسکوپ الکترونی ارائه می دهند که سرعت و دقت بی نظیری را ارائه می دهند. مفهوم مازولار سخت افزار نرم افزار، گسترش سیستم اولیه شما را با آشکارسازهای EDS، WDS و EBSD اضافی و همچنین یک منبع میکرو اشعه ایکس آسان می کند و انعطاف پذیری کاملی را برای هر آنچه که اکنون یا در آینده نیاز دارید، فراهم می کند.

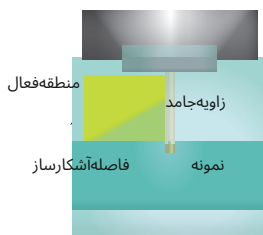
ادغام یکپارچه چهار تکنیک آنالیز در مجموعه نرم افزاری جامع ESPRIT، راهکارهای پیشرفته ای را برای هر کاربردی فراهم می کند. راهکارهای اختصاصی برای TEM و STEM، بهترین عملکرد تحلیلی را در مقیاس نانو و اتمی تضمین می کنند.

به عنوان بخشی از XFlash® خانواده V آشکارساز، XFlash منحصر به فرد® آشکارساز FlatQUAD با چهار بخش آشکارساز حلقوی شکل، به سوالات شما در مورد کاربردهای جالب برانگیز، مانند کیلوولت پایین، جریان پرتو کم، توپوگرافی سطح، پاسخ می دهد.

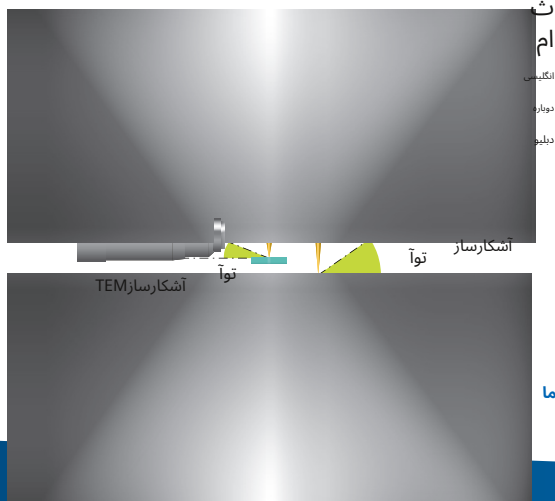
زاویه جامد

زاویه فضایی هندسی، که در EDS به آن زاویه جمع آوری تحلیلی می گویند، بخشی از پرتوهای ایکس را که می توانند ثبت شوند، تعیین می کند. این زاویه به عنوان بخش مخروطی از یک کره فرضی اطراف منبع تابش (ناحیه فلورسنت نمونه) تعریف می شود که توسط ناحیه فعال آشکارساز پوشانده شده است.

زاویه فضایی بر حسب استرادیان (sr) اندازه گیری می شود. در مورد سطح آشکارساز مسطح غیر کروی، این زاویه تقریباً متناسب با مساحت آشکارساز فعال تقسیم بر مجذور فاصله آشکارساز از نمونه است. آشکارسازی با مساحت فعال کوچک که در نزدیکی نمونه قرار گرفته است، زاویه فضایی بهتری نسبت به آشکارسازی با مساحت فعال بزرگ که در فاصله دورتری قرار گرفته است، ارائه می دهد.



تا زاویه انحراف (TOA)



ایکس اف ال شما

زاویه فضایی بزرگ برای جمع آوری اشعه ایکس، که بزرگترین آن بزرگتر از 1.1 sr است، امکان تجزیه و تحلیل کارآمد نمونه های حساس (بیولوژیکی) را فراهم می کند، که نیاز به استفاده از کیلوولت کم و جریان پرتو کم دارد.

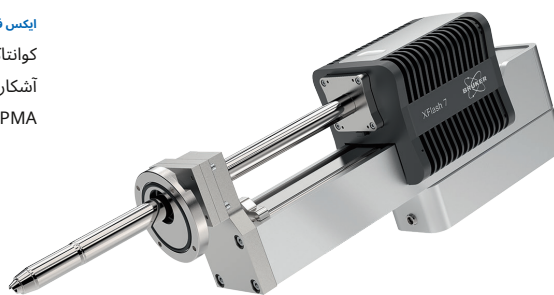
سرعت آنالیز بی نظیر - تا 1000 کیلو سی بر ثانیه توان عملیاتی آنالیز برای سریع ترین اندازه گیری ها و تعیین مقدار فراتر از ISO15632:2012 بالاترین دقت و قابلیت اطمینان نتایج تعیین مقدار با استفاده از جامع ترین پایگاه داده اتمی با بیش از 2200 خط عنصر

داده کاوی کامل (آنلاین و آفلاین) به لطف تصویربرداری فرافوقی بلادرنگ و روش های کمی سازی ترکیبی

خودکارسازی نقشه برداری المان های با زمان حل شده و مساحت بزرگ، به حداکثر رساندن زمان کارکرد سیستم از طریق تعویض ماژول SDD در محل و کاهش نیاز به کالیبراسیون مجدد به دلیل پایداری بالای سیستم

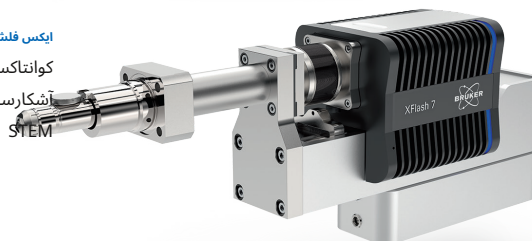
ایکس فلش 7

کوانتاکس ادز
آشکارساز برای SEM،
FIB-SEM و EPMA



ایکس فلش 7 تی

کوانتاکس ادز
آشکارساز برای TEM و
STEM



آنالیزورهای میکروسکوپ الکترونی

بروکرنانو، شرکت

برلین، آلمان

info.ema@bruker.com

www.bruker.com/xflash7

